



CHRcodile IT – Optischer Sensor Wafer & Solarzellen berührungslos vermessen



CHRcodile

If time matters...

Sensor Eigenschaften

- Hohe Messrate: 4 kHz
- Hohe Genauigkeit (in Si): bis zu 70 nm *
- z-Höhenauflösung: bis zu 1 nm *
- Laterale Auflösung: 6,5 µm
- Si-Dicke von 7 µm bis 1 mm
- Messen auch von GaAs
- Transparente Lacke/Folien von 17 µm bis 2,3 mm
- Robuster Messkopf ohne Elektronik und Lichtquelle

*bezogen auf CHRcodile IT 250

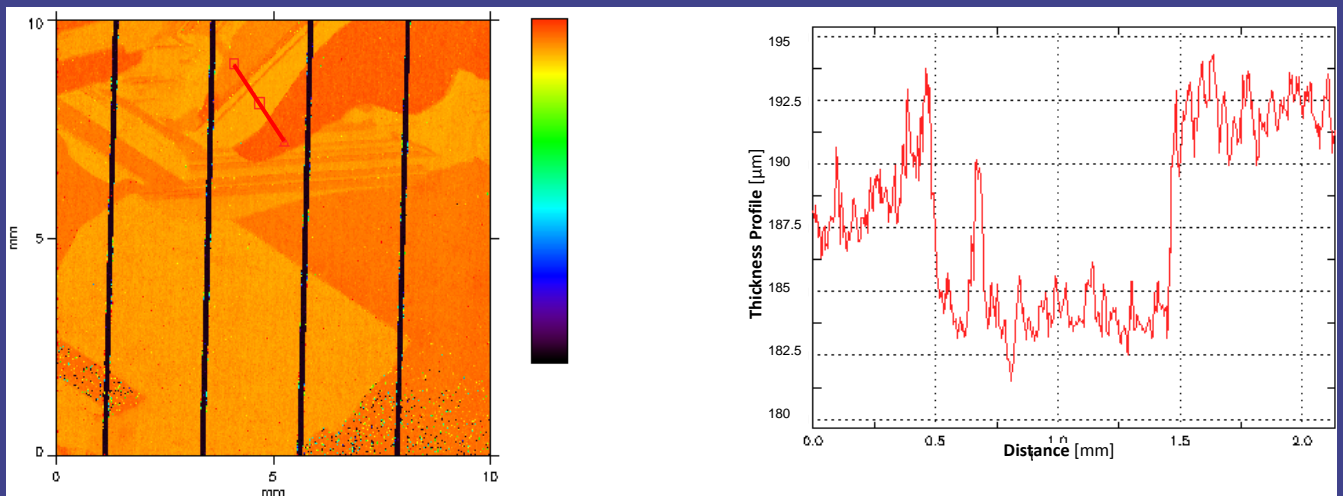
Weitere Infos:
www.CHRcodile.de

Eine sehr einfache und gleichzeitig hochgenaue Abstands- und Schichtdickenmessung von Wafern, Solarzellen und Modulen bietet das neue **CHRcodile IT** von Precitec Optronik. Es ist in der Lage, berührungslos mit nur einem Messkopf Silizium sehr exakt bis zu einer Dicke von 1 mm zu vermessen.

Hintergrund dieses neuen, zerstörungsfreien Messverfahrens ist ein interferometrisch arbeitender Sensor, der mit Infrarotlicht das Silizium durchleuchtet.

Das **CHRcodile IT** kann durch seinen robusten und einfachen Aufbau direkt in den Produktionsprozess integriert werden. Natürlich bietet sich das Gerät auch als kostengünstige und gleichzeitig hochpräzise Schichtdickenmessung im Labor an.

Dicken – Scan einer Solarzelle



Kontakt:

Precitec Optronik GmbH, Raiffeisenstrasse 5, 63110 Rodgau (Germany)

Tel.: +49 (0) 6106 / 8290-0 • Fax.: +49 (0) 6106 / 8290-26

E-Mail: Info@Precitec-Optronik.de, Internet: www.CHRcodile.de